



高铝组分氮化物材料外延及原位监测集成化设备研制

项目类型: 国家重大科研仪器设备研制专项项目

项目批准号: 61527814 **起止年限:** 2016-2020



仪器简介

高铝组分氮化物材料外延及原位监测集成化设备，在反应室设计上采用垂直象限式结构，不同源进气采用扇形象限分布和氮气隔离源材料的技术，解决了寄生反应预淀积的问题；采用多区域加热独立控制，实现高温下温场均匀性，反应室反应气场中温度梯度分布，减小了高温下杂质析出和源预反应污染；反应源气体输运设计上采用双量程结构，实现了宽V/III比范围的同时，实现了反应室供气匀气、温度压力、精确控制等方面达到外延系统整体一致性；优化原位监测系统，可以实现生长过程的精确可控和高温下特殊的机理研究。

技术指标

- 1、一次性可生长3片3英寸高铝组分氮化物材料；
- 2、衬底温度范围100~1500°C，温度稳定性<±2°C，升温速率0.5°C~3°C/s 连续可调；
- 3、反应室压力控制范围20~760 Torr 连续可调，控制精度为1 Torr (50Torr~760Torr)；
- 4、系统气密性：管路系统漏气率<1×10⁻⁹Pa · L/S；反应室漏气率<3×10⁻⁹Pa · L/S；
- 5、原位实时监测生长过程中衬底和外延层的组分、厚度以及发光特性等：波长分辨率0.5nm，组分分辨率1%，厚度分辨率1nm。

应用领域

该设备主要应用于高铝组分氮化物材料的外延生长，在此基础上可以应用于日盲型紫外光电探测器、高效率固态深紫外光源、大功率电子器件。

应用案例

目前，该设备应用于深紫外LED外延生长，已获得深紫外LED全结构外延片，技术指标达到国内先进水平。

联系信息

联系人: 魏学成 **移动电话:** 13811856770 **E-mail:** xcwei@semi.ac.cn

通讯地址: 北京市海淀区清华东路甲35号半导体所5号楼407